

Seminarprogramm Sommersemester 2024

Fortgeschrittene Anwendungen der Rasterelektronenmikroskopie in Industrie und Forschung

Semindauer: 8 Std., Termin nach Vereinbarung
Seminarort: HTBLVA Spengergasse 20, 1050 Wien
Preis pro Person u. Tag: 450,- exkl. 20% MWSt. inkl. Seminarunterlagen
Anmeldungen: per Mail an versuchsanstalt@spengergasse.at
Referent: Dr. Walter Costin

Dieses Seminar richtet sich an erfahrene Fachleute und bietet eine vertiefte Erkundung fortgeschrittener Anwendungen der Rasterelektronenmikroskopie (REM) in Industrie und Forschung.

Analytische Methoden in der Rasterelektronenmikroskopie

- Einführung in EDX, WDX und EBSD
- Unterschiede und Stärken der einzelnen Verfahren

In-situ Prüfmethode bei verschiedenen Längenskalen

- In-situ makro- und mikromechanische Prüfungen im REM
- In-situ Nanoindentierung und Atomic Force Microscopy (AFM)
- In-situ Untersuchungen bei thermischer Belastung

Zielgruppe:

Forscher, Ingenieure, Techniker und Experten aus verschiedenen Industriesektoren

Produktentwickler, Qualitätssicherungsbeauftragte und Techniker

Fortgeschrittene Mikroskopieanwender und Analytiker

Interessierte aus der Forschung und Entwicklung mit einem professionellen Hintergrund.

